



SpecMetrix®

增强型实验室涂层厚度测量系统



工业物理
以己之力 · 护彼之名

增强型实验室涂层厚度测量系统

SpecMetrix®增强型实验室系统为用户提供高标准的非接触、非破坏性和实时的绝对厚度测量数据，适用于已应用的涂层和涂覆层。

SpecMetrix®增强型实验室涂层厚度测量系统旨在简化质量控制流程，无论是在实验室环境中的离线样品测试，还是与周期性在线涂层验证结合使用。它能够帮助用户防止成千上万英尺的有缺陷材料，节省时间和成本。

SpecMetrix增强型实验室系统通过提高对多种基材的检查，优化了涂层工艺和质量控制，非常适合试验线、测试设施和频繁换型的环境。它是多个行业的质量控制实验室和生产线中信赖的系统之一，提供亚微米级精度的绝对涂层厚度数据。



设备特点与优势：

- **灵活快速**
模块化设计使得离线或部分在线测量使用更快。
- **非接触式**
测量过程中不接触涂层或基材，保持样品和部件的完整性。
- **绝对厚度测量**
超高精度的实时涂层和层厚度测量，加速样品测试、数据收集和质量分析。
- **基材独立**
可测量涂覆的部件及应用在透明、有色或着色基材上的涂层。
- **广泛应用**
实时测量单层或双层涂层以及多层膜，精度达到亚微米级，适用于湿涂层或干涂层。
- **无危害性**
采用独特的非放射性和非侵入性 ROI 增强光学干涉测量技术。
- **环保**
非破坏性测试方法有助于减少废料、返工劳动力和能源成本。
- **强大的SensorMetric软件**
用户友好的软件包将所有数据存储到Excel®中，或与工厂网络接口，以便进行SPC分析。

可选附件：

SpecMetrix 增强型实验室系统包括多个实验室和在线配件。



▲ 通过带有加固探头的磁臂进行定期的在线测量。



▲ SpecMetrix 增强型实验室系统包括多个实验室和在线配件。

技术规格:

测量范围	0.3至250微米 (涂层厚度)
精度	涂层厚度的±1% (标称值)
测量速度	每秒最多100次
温度范围	0° 至45° C
输出指标	微米、密耳、mg/in ² 、mg/4in ² 、g/m ² 、mg/cm ² 、lbs/令
操作系统	Windows® 平台
制造	美国制造
认证	CE (E) (S) (UL)
系统组件	<ul style="list-style-type: none">• 处理单元• 触摸屏控制• 操作员输入键盘• 样品测试台和固定器• 光学探头组件• 实验室探头• 坚固的在线探头• 磁性臂和安装套件• NIST可追溯的厚度标准

免责声明

本档中包含的信息可能会根据经验和我们持续产品开发的政策不时修改。请查看工业物理 Industrial Physics 网站以获取最新版本。

Industrial Physics 工业物理

电话: 400 878 1858

邮箱: info.china@industrialphysics.com

网址: www.industrialphysics.cn

www.industrialphysics.com

